

マイクロストリップ線路の曲がり部による不要放射

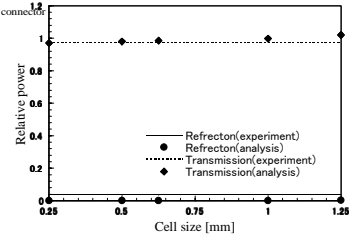
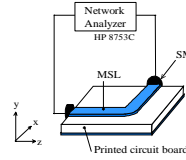
背景

- 電子機器の高速化・小型化・高集積化
- 回路の不連続部より不要放射
 ↓ (接続部・曲がり・分岐・線路幅変化)
 機器の特性の劣化・誤動作を引き起こす

目的

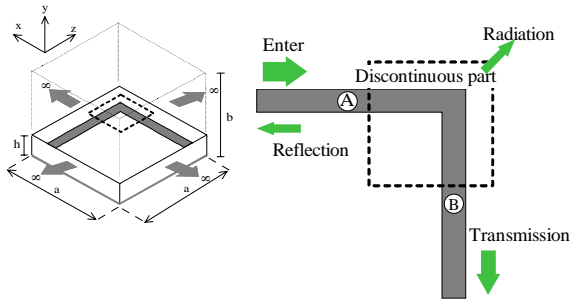
- 回路の曲がり部に着目
- FD-TD解析による形状による不要放射の把握
- 誤動作の予測・設計指針

セルサイズによる有効性

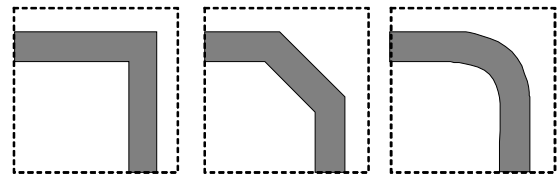


曲状MSL, $w=5\text{mm}$, $r=15\text{mm}$, 3GHz

評価方法



解析対象

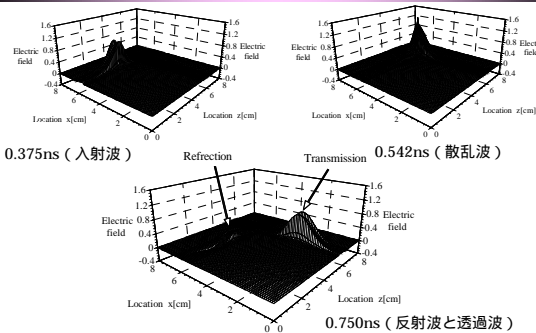


(a)直角MSL

(b)斜めMSL

(c)曲状MSL

パルス伝搬の様子



周波数特性

